



鉛フリーはんだの信頼性評価 デジタルマイクロスコープでの試料観察や各種環境試験

技術分野分類 5103：電子デバイス・電子機器

技術キーワード A：電子デバイス・集積回路

産業分類 E-28：電子部品・デバイス・電子回路製造業

内 容	概要	環境問題から、従来の鉛はんだは多くの分野で鉛フリーはんだに置き換わったが、両者の性質の違いから不良が発生する場合がある。当所では、このような不良の対策への足がかりとして、マイクロスコープによる試料表面・断面の観察や、環境試験装置を用いた加速試験などによる信頼性評価を行っている。
	従来技術・競合技術との比較 (優位性)	倍率35～2500で偏光など複数のアダプタを備えるデジタルマイクロスコープや、恒温恒湿槽・冷熱衝撃試験装置・プレッシャークッカー試験装置などの環境試験装置を有している。
	本技術の有用性	環境試験装置による試料の加速試験から、断面研磨やマイクロスコープによる試料表面・断面の高倍率観察まで行うことができる。
関連情報 (図・表・写真等)		   <p>環境試験装置 デジタルマイクロスコープ リード・はんだ接合部断面の観察</p>
適用可能製品		プリント基板を始め、金属部品やプラスチック部品など様々な試料
技術シーズ 保有者	氏名 所属・役職	村瀬 真 名古屋市工業研究所 システム技術部 電子技術研究室 研究員
技術シーズ 照会先	窓口 TEL/FAX e-mail	名古屋市工業研究所 支援総括室 052-661-3161 / 052-654-6788 kikaku@nmiri.city.nagoya.jp

■知的財産 なし

■試作品状況



提示可

提供可

作成日 2012年10月9日